

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-340566

(43)Date of publication of application: 10.12.1999

51)Int.CI.

H01S 3/18

21)Application number: 10-159949

SEJ UNG

(71)Applicant : CANON INC

22)Date of filing:

25.05.1998

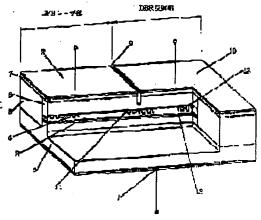
(72)Inventor: SEKIGUCHI YOSHINOBU

54) DISTRIBUTION REFLECTION TYPE POLARIZATION-MODULATION SEMICONDUCTOR LASER

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polarization-modulating emiconductor laser which has the large degrees of allowance to

tructure or manufacturing process.

SOLUTION: This polarization-modulation semiconductor laser is a listribution reflection type one. in which a DFB laser part and a DBR eflection part having an active layer 3 where a difference of gain setween TE polarization mode and TM polarization mode is small, are arranged in the direction of an optical resonator. The laser has such a structure that can control the reflected light from the DBR reflection part to the DFB laser part, thereby switching laser oscillation between TE and IM polarization modes.



EGAL STATUS

Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of ejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP). (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-340566

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

(51) Int.Cl. 6

識別紀号

FΙ

. HOIS 3/18

H01S 3/18

審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 8 頁)

(21)出願番号

特顯平10-159949

(71)出源人 000001007

キヤノン株式会社

(22) 出願日

平成10年(1998) 5月25日

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 関口 芳信

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

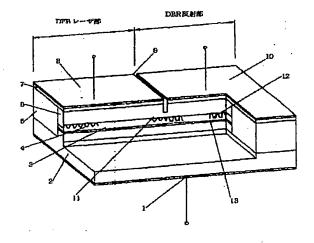
(74)代理人 弁理士 加藤 一男

(54) 【発明の名称】 分布反射型偏波変闘半導体レーザ

(57) 【要約】

[課題] 構成や作製プロセスに対して許容度が大きい偏 波変調半導体レーザである。

【解決手段】偏波変調半導体レーザは、TE偏波モード とTM偏波モードの利得差が小さい活性層3を有するD FBレーザ部とDBR反射部が光の共振器方向に配置さ れた分布反射型半導体レーザである。DBR反射部から DFBレーザ部への反射光を制御できる構成を持ち、そ れによりレーザ発振をTE偏波モードとTM偏波モード 間でスイッチングさせる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】TE偏被モードとTM偏被モードの利得差が小さい活性層を有するDFBレーザ部とDBR反射部が光の共振器方向に配置された分布反射型半導体レーザにおいて、DBR反射部からDFBレーザ部への反射光を制御できる様に構成され、それによりレーザ発振をTE偏波モードとTM偏波モード間でスイッチングさせることを特徴とする偏波変調半導体レーザ。

【請求項 2 】 D B R 反射部が、注入電流または印加電界の制御によって、一方の偏波モード光を反射する状態と他方の偏波モード光を反射する状態の間で変化できる様に構成され、それによりレーザ発振をT E 偏波モードとT M 偏波モード間でスイッチングさせることを特徴とする請求項 1 記載の偏波変調半導体レーザ。

【請求項3】DBR反射部を、反射波長がDFBモードの一方の偏波モードに一致している様に制御できる第1 DBR領域と、反射波長がDFBモードの他方の偏波モードに一致している様に制御できる第2DBR領域で構成し、DFBレーザ部への反射光を、第1DBR領域の一方の偏波モードと第2DBR領域の他方の偏波モードの間で切り替えることにより、レーザ発振をTE偏波モードとTM偏波モード間でスイッチングさせることを特徴とする請求項1記戦の偏波変調半導体レーザ。

【開求項4】DFBレーザ部の活性層のTE偏波モードとTM偏波モードの利得差が小さくなる様に構成されていることを特徴とする請求項2または3記載の偏波変調半導体レーザ。

(請求項5) DBR反射部が、注入電流または印加電界の制御によって、一方の偏波モード光を反射する状態と該偏波モード光を吸収する状態または透過する状態の間で変化できる様に構成され、それによりレーザ発振をTE偏波モードとTM偏波モード間でスイッチングさせることを特徴とする間求項1記載の偏波変調半導体レーザ。

【請求項6】DFBレーザ部とDBR反射部の間に、電流注入または電界印加の制御によって厄折率を変化できる様に構成された位和調整領域が設けられ、該屈折率変化により位相整合波長をDBR反射部の一方の偏波モード光の反射波長に一致させることでレーザ発振を他の偏波モードから該一方の偏波モードにスイッチングさせることを特徴とする請求項1記載の偏波変調半導体レーザ

【請求項7】前記位相關整領域が位相シフト構成を有することを特徴とする請求項6記載の偏波変調半導体レーザ

【精求項8】 DBR 反射部の向折格子の結合係数は、DPBレーザ部の向折格子の結合係数より大きく設定されていることを特徴とする開求項1 乃至7 の何れかに記載の偏波変調半導体レーザ。

【請求項9】請求項1乃至8の何れかに記載の偏波変調

半導体レーザの駆動方法において、DBR反射部または 位相調整領域に印加する電流または電圧を制御すること によって、レーザ発振をTE偏波モードとTM偏波モー ド間でスイッチングさせることを特徴とする偏波変調半 導体レーザの駆動方法。

【請求項10】光を使って通信を行なう光通信ネットワークにおいて、前記ネットワークに接続された少なくとも一台の端末が、光信号発生の手段として請求項1乃至8の何れかに記載の偏波変調半導体レーザを備えていることを特徴とする光通信ネットワーク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信等に使用される半導体レーザに関し、特に、レーザ発振の偏波がT EモードとTMモード間でスイッチングできる構造を持つ半導体レーザ、それを用いた装置等に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、発振モードがTE偏波とTM偏波の間でスイッチングする偏波スイッチング半導体レーザについて、特別平2-159781に記載された様な構成がある(図6)。同図の半導体レーザは、 $\lambda/4$ シフトを有する分布帰還型半導体レーザであり、 $\lambda/4$ シフトがある部分とそれ以外の部分とに別々に電流注入を行える電極構造となっている。

【0003】同図において、10はn-InP拡板、12は中央に λ /4位相シフト部を有する1次の回折格子、14は厚さ0、1 μ mのn-InGaAsP光導波層(パンドギャップ波長 λ g = 1、27 μ m)、16はアンドーブInGaAsP活性層(パンドギャップ波長 λ g = 1、55 μ m、厚さ0、1 μ m)、18はp-GaInAsPアンチメルトバック層、19はp-InPクラッド層、20はp-InP個、23はp-InP層、20はp-InP層、23はp-InP層、24はアンドーブInGaAsPキャップ層、26、28は電極、27は λ /4シフト部分を含む領域へ電流を注入するための電極、29は λ /4シアの偏波成分のみを通す偏光子である。

【0004】更に、図示する様に、横方向の光と電流の閉じ込めは、メサストライプ構造で行なっている。また、中央の位相シフトを設けた部分には、上記の様に、他の部分と独立に電流注入可能とするための電極27が設けられている。本従来例では、活性層16がInGaAsPのパルクであるため、TE偏波とTM偏波に対する利得がほぼ同じである。そのため、しきい他以上の電流を電極26(中央の位相シフト部以外の部分)に流すことにより、TE偏波とTM偏波間の利得のわずかな差、導波路や回折格子の偏波依存性によってDFBレーザは何れか一方の偏波モードで発振する。この状態において、位相シフト部に電流を注入すると、位相が、レー

ザ発振している一方の偏波モードに対する整合条件を満たす状態から他方の偏波モードに対する整合条件を満たす状態にスイッチングし、DFBレーザの発振モードが一方の偏波から他方の偏波にスイッチングするものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来例では、共振方向に均一な構成(均一な活性層、均一な回折格子)であり、位相シフト部への注入電流で位相整合条件のみを制御して、偏波スイッチングを実現していた。このため、半導体レーザの下上利得とTM利得し、非常に接近していることが重要な要件となるが、レーザの総合的な利得は活性層のTE/TM利得だけでなく、高波路の断面形状、無反射コーティング端面の残留反射率、回折格子の形状、素子温度、注入電流等によっても変化するため、特性の揃った偏波変調レーザを作製することは容易ではなかった。

[0006] 本発明の目的は、上記従来例の課題を解決するためになされたもので、半導体レーザの構成や作製プロセスに対して許容度が大きい偏波変調ないし偏波スイッチング可能な構成の半導体レーザ及びそれを用いた装置等を提供することにある。

[0007]

【課題を解決する為の手段及び作用】上記目的を実現す る為に、本発明の偏波変調半導体レーザは、TE偏波モ ードとTM偏波モードの利得差が小さい活性層を有する DFBレーザ部とDBR反射部が光の共振器方向に配置 された分布反射型半導体レーザにおいて、DBR反射部 からDFBレーザ部への反射光を制御できる様に構成さ れ、それによりレーザ発振をTE偏波モードとTM偏波 モード間でスイッチングさせることを特徴とする。即 ち、DFBレーザ部とDBR反射部(回折格子と導波光 の結合係数がDFBレーザ部より大きい)が共振器方向 に配置されており、それぞれに独立に電流注入或は電圧 印加が可能な構成となっている。更に、DFBレーザ部 の活性層は、TE偏波モードとTM偏波モードの利得差 が小さいので、DFBレーザ部にしきい電流値以上の電 流を注入すると、両方の偏波モードで発振可能となる が、それぞれの偏波モードの波長とDBR反射部からの 反射波長(言い換えれば、反射偏波モード或はブラッグ 波長)との差異、両方の偏波モード間の活性層の利得 差、両方の偏波モード間の端面反射の差、両方の偏波モ ードの端面位相の差により一方の偏波モードでレーザ発 振が生じる。

【0008】上記状態において、DBR反射部への電流 往人又は電界印加の制御を行なうことで、DBR反射部 からDFBレーザ部への反射光の波長をDFBレーザ部 のTE偏波モードの波長又はTM偏波モードの波長に近 付けることで、レーザ発振の偏波をTE/TM間でスイ ッチングさせるものである。

【0009】より具体的には、以下の如き態様が可能で ある。第1には、DBR反射部が、注入電流または印加 電界の制御によって、一方の偏波モード光を反射する状 態と他方の偏波モード光を反射する状態の間で変化でき る様に構成され、それによりレーザ発振をTE偏波モー ドとTM偏波モード間でスイッチングさせる。即ち、D BR反射部への電流注入义は電界印加の制御によって、 DBR反射部の導波路の実効屈折率を変化させることに より、DBR反射部のブラッグ波長(反射波長、反射偏 波モード)をDFBレーザ部の一方の偏波モードの波長 から他方の偏波モードの波長へ変化させ、レーザ発振の 傷波をTE/TM間でスイッチングさせるものである。 【0010】第2には、DBR反射部を、反射波長がD FBモードの一方の偏波モードに一致している様に制御 できる第1DBR領域と、反射波長がDFBモードの他 方の偏波モードに一致している様に制御できる第2DB R領域で構成し、DFBレーザ部への反射光を、第1D BR領域の…方の偏波モードと第2DBR領域の他方の 偏波モードの間で切り替えることにより、レーザ発振を TE偏波モードとTM偏波モード間でスイッチングさせ る。即ち、DBR反射部が一方の偏波モードを反射する 為の第1反射部と他方の偏波モードを反射する為の第2 反射部から構成されている。DFBレーザ部の活性層 は、TE偏波モードとTM偏波モードの利得差が小さ く、しきい電流値以上の電流を注入するとDFBレーザ 部に近い側の第1反射部のブラッグ反射波長の偏波モー ドで発振する。更に、この第1反射部への電流注入又は 電界印加の制御により実効屈折率を変化させ第1反射部 のブラッグ反射波長を…方の偏波モードからシフトさせ ることで、発振波長(両偏波モードの)に対してこの領 域を透明にし、DFBレーザ部から違い側の第2反射部 を機能させ、レーザ発振の偏波モードをDFBレーザ部 から遠い側の第2反射部の偏被モードにスイッチングさ せるものである。

【0011】第1及び第2の態様では、DFBレーザ部の活性層においてTE偏被モードとTM偏波モードの利得差が小さくなる様に設定されている。

【0012】第3には、DBR反射部が、注入電流または印加電界の制御によって、一方の偏波モード光を反射する状態と該偏波モード光を吸収する状態または透過する状態の間で変化できる様に構成され、それによりレーザ発振をTE偏波モードとTM偏波モード間でスイッチングさせる。即ち、DFBレーザ部の活性層の利得を一方の偏波モードに対して備かに優位にし、DBR反射部のブラッグ波及は両方の偏波モードを反射しない状態

(該偏被モードを吸収する状態または透過する状態)に 設定する。DFBレーザ部への電流注人により、活性層 利得が値かに優位な一方の偏波モードでレーザ発振が生 じる、この状態から、DBR反射部への電流注入又は電 界印刷の側御によって、DBR反射部のブラック被長を 他方の偏波モードを反射する状態とすることにより、レーザ発振の偏波モードをスイッチングさせるものである。

[0013] 第4には、DFBレーザ部とDBR反射部 の間に、電流注入または電界印加の制御によって屈折率 を変化できる様に構成された位相調整領域が設けられ、 該屈折率変化により位相整合波長をDBR反射部の一方 の偏波モード光の反射波長に一致させることでレーザ発 **振を他の偏波モードから該一方の偏波モードにスイッチ** ングさせる。DFBレーザ部の活性層の利得を一方の偏 波モードに対して僅かに優位にし、DBR反射部のブラ ッグ波長は他方の偏波モードを反射する状態に設定す る。DFBレーザ部への電流注入により、活性層利得が 僅かに優位な一方の偏波モードでレーザ発振を生じる。 この状態から、位相調整領域への電流注入又は電界印加 の制御による屈折率変化により、位相整合波長をDBR 反射部のブラッグ反射波長に一致させることにより、レ ーザ発振をDBR反射部の反射偏波モードへスイッチン グさせるものである。

【0014】第3及び第4の鉱様では、DFBレーザ部の活性層において一方の偏波モードの利得が前記他方の偏波モードの利得より大きくなる様に設定されている。

【0015】以上の構成において、DBR反射部の回折格子の結合係数を比較的大きく散定することで、DBR反射部の長さを小さくできて光損失を少なくでき、効率的なレーザ発振が可能になる。この際、DBR反射部の反射波長の線幅は比較的広くなり、DFBレーザ部の線幅の狭いDFBモードとの重なり具合の制御が容易になり、偏波スイッチングがより確実且つ安定的にできる様になる。DBR反射部の反射波長の線幅は比較的広くなるが、発振の線幅はDFBモードで規定されるので問題はない。

[0016] 本発明の偏波変調半導体レーザの駆動方法は、上記の偏波変調半導体レーザのDBR反射部または位相調整領域に印加する電流或は電圧を制御することにより、レーザ発振をTE偏波モードとTM偏波モード問でスイッチングさせることを特徴とする。

【0017】本発明の光通信ネットワークでは、光通信ネットワークに接続された少なくとも一台の端末が、送信信号を光信号に変換する為に本発明の偏波変調半導体レーザを使うものである。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の半導体レーザを偏 被変調レーザに適用した実施の形態、その駆動方法及び それを光通信システムに用いた具体例を説明する。

【0019】第1実施例

図」は、本実施例の特徴を最も良く表わす傷波変調レーザの一部破断した機略構成料視図である。本偏波変調レーザは、導波光と回折格子の結合係数が比較的小さい30cm⁻¹程度の分布帰還(DFB)領域(通常のDFB

レーザにおける結合係数の大きさと同程度である)と、 結合係数が比較的大きい200cm⁻¹ 程度のブラッグ反 射(DBR)領域で構成されている。

【0020】同図において、1は共通電極、2はn-1 n P 基板及び下部光閉じ込め層、3はDFBレーザ部の 活性層である。活性層3は、厚さほぼ13nmのInG a A s (引っ張り歪み≒-0.6%) 5層と厚さほぼ1 Onmでパンド端波長1. 15μmのInGaAsP4. 層で構成されており、TE偏波モードとTM偏波モード の利得差が小さくなっている(TE偏波モードの利得が TM偏波モードの利得より若干大きい)。また、4は厚 **さ200nmでバンド端波長1.15μmのp-InG** aAsPで構成される光導波層、5は導波光と注入電流 をストライプ内に閉じ込める為の高抵抗InPで構成さ れる狭窄層、6はp-InP上部光閉じ込め層、7は金 属電極8、10との電気的接続の為の低抵抗p-InG aAsで構成されるコンタクト層、9はDFBレーザ部 とDBR反射部を電気的に分離し、夫々に独立に電流注 人を可能にする為の分離海、11は光導波層4と上部光 閉じ込め層6の界面に形成されたDFBレーザ部の回折 格子(周期≒238nm)であり、導波光と回折格子1 1の結合係数は30cm⁻¹程度である。

【0021】更に、12はDBR反射部の回折格子(周期=238nm)であり、その結合係数は200cm⁻¹程度である。13はDBR領域の導波路内にあるコアであり、本実施例ではDFB領域の活性層3と同じ構成である。DFBレーザ部、DBR反射部の共振器方向の長さは、それぞれ300 μ mであり、ストライブ導波路の幅は、およそ2 μ mである。

【0022】上記構成において、DFBレーザ部にしき い電流値以上の電流を流すと、活性層3はTE偏波とT M偏波間の利得差が小さいので、両方の偏波モードで発 振可能な状態となる。TE偏波とTM偏波のDFBモー ド (この場合、回折格子11に位相シフト部が設けられ ていないので、DFBモードはそれぞれの偏波のストッ プバンドの長波長側成は短波長側に立つ。回折格子 1 1 に位相シフト部を設ければDFBモードはそれぞれの偏 波のブラッグ波長に一致する)は、導波路の実効爪折率 の偏波分散が0.01程度あるので、およそ4nmの波 長差が生じる。ここで、DBR反射部の反射ピーク波長 を長波長側の偏波波長に一致させておくことにより、こ の波長のDFBレーザ部への反射量が大きくなり、長波 側の偏波のDFBモードでレーザ発振する。DBR反射 部での光損失を少なくする為にDBR反射部の結合係数 を大きくしてある。

【0023】ここでDBR反射部に電流を注入するとブラズマ効果で実効屈折率が減少し、DBR反射波長が短波長側にシフトする。電流注入により屈折率をおよそ0.01変化させると、DBR反射部のブラック波長が約4nm短波長側にシフトするので、DBR反射部の反

射波長が短波長側のDFBモード(通常はTMモード)に一致する。このため、DFBレーザ部への反射波長は、長波長側から短波長側にスイッチし、これに伴いレーザ発振がDFBモードの長波側の偏波(通常はTEモード)から短波側の偏波(通常はTMモード)にスイッチングする。

【0024】ところで、DBR反射部での注入電流による導波光に対する実効屈折率の変化は、波長依存性があり、コア層13のバンド端波長からの離調に大きく依存するが、同一活性層(本実施例ではDBR領域のコア層13とDFB領域の活性層3と同じ構成である)のレーザ発振波長において、キャリヤ濃度1×10 ¹⁸ / c m³の変化に対し0.02程度変化する。したがって、DBR反射部へのキャリヤ注入による屈折率変化は、DBR反射部の反射波長をTE偏波モードからTM偏波モードに変化させるのに充分である。

[0025] 図4は、本発明の偏被変調レーザを光通信の為の送信部として使用する場合の概略構成を示すものである。駆動回路に入力された電気信号は、バイアス電流に重畳されて分布反射型半導体レーザのDBR反射部に印加され、一方、DFBレーザ部には、駆動回路からバイアス電流のみが供給される。DFBレーザ部端面から出力されるレーザ光は、駆動回路に入力された電気行ら出力されるレーザ光は、駆動回路に入力された電気行号に対応して、偏波モードがTE/TM間でスイッチの個光型択手段により一方の偏波モード光のオン/オフ信号が得られる。なお、図4には記載されていないが、必要に応じて、集光のためのレンズ光学系を偏光選択手段とレーザ素子との間に設けてもよい。

【0026】図5は、本発明の偏波変調レーザを送信部に使用した波長多重通信ネットワークの概略構成図である。送信側では、波長の異なる光信号を送出する送信器に本発明の偏波変調レーザを使用している。各送信器から出力された波長の異なる光信号(入1、入2、・・・、入1)は、合流器によって波長多重され、一木の光ファイバで、受信側に伝送される。受信側では、波長多重された信号を分岐器により各受信端末に分配し、各端末の受信部で波長フィルターにより特定の波長または任意の波長を分離/受信するものである。

[0027] 第2実施例

第2の実施例は、DBR反射部が電流非注入状態でDFBレーザ部からの導波光を吸収し、DBR反射部への電流注入によりここの損失を低減させることにより、DBR反射部を一方の偏波モードの反射器として作用させて偏波スイッチングを実現するものである。

【0028】構成上第1実施例と異なる部分は、DFBレーザ部の活性層3およびDBR反射部の導波路のコア13である。第1実施例と同じく図1を用いて説明すると、DFBレーザ部の活性層3は、厚さほぼ11nm

(第1実施例ではほぼ13 nmである。従って、操子準

位間の間隔が若干大きくなっており発振波長が若干短くなる)のInGaAs(引っ張り発≒-0.4%)5層と厚さほぼ10nmでパンド端波長1.15μmのInGaAsP4層で構成されており、第1実施例の活性層よりTE利得がTM利得よりより大きくなるように構成されている(第1実施例より引っ張り歪の量が若干小さい)。したがって、DBR反射部が非注入状態で、TE偏波で発振する(DFBレーザ部が独立で動作しているような状態である)。

【0029】一方、DBR反射部の導波路のコア13 は、厚さほぼ13nmのInGaAs (引っ張り盃≒ー 0. 4%) 15層と厚さほぼ10nmでバンド端波長 1. 15μmのInGaAsP 14層で構成されてい る。量子準位がDFBレーザ部の活性層3より若干小さ くなっており、DFBレーザ部の発振波長を吸収する関 係にある。従って、DBR反射部は、非注入状態では、 DFBレーザ部からの導波光を吸収するが、電流注入に より吸収損失を減少させる。DBR反射部が、非注入状 態におけるTE偏波モード発振から、電流注入により、 DFBレーザ部のTM偏波モード光に対するDBR反射 器として作用すると(この電流注入状態でDBR反射部 の反射波長がDFBレーザ部のTM偏波モードに一致す る様に回折格子のピッチ等を設定しておく)、DFBレ ーザ部へのTM偏波モード光の反射光量が増大し、発振 がTE偏波からTM偏波へスイッチングする。

【0030】DBR反射部への電圧印加で量子閉込めシュタルク効果(QCSE)により制御する場合は、電圧印加でDFBレーザ部からの導波光を吸収し、電圧非印加状態で発振がTE偏波からTM偏波へスイッチングする様に設計する。

【0031】以上の説明では、TE偏波からTM偏波へのスイッチングであるが、DFBレーザ部の活性層をTM利得がTE利得より大きくなる様に設定し、次の様にすることも可能である。即ち、DBR反射部が非注入状態で、TM偏波で発振するように構成し、DBR反射部への電流注入により、DBR反射部を吸収状態からTE偏波の反射器として作用させ、TE偏波にスイッチングさせることも可能である。

[0032] 第3実施例

図2は、本発明の第3の実施例の光伝搬方向の概略構成 断面図であり、端面に反射防止膜201の形成されたD FBレーザ部とDBR反射部の間に、位相調整領域を設 けている。位相調整領域は、分離満291、292によ り独立に電流注入可能に構成されている。DFBレーザ 部の活性層3の構成は、第2実施例と同様であり、位相 調整領域の等液層241とDBR反射部の導波路のコア 242は、第2実施例のDBR反射部の導波路コア13 と同じ構成である。図2において、図1の符号と同符号 で示すものは同じ機能の部分であることを示す。

。【0033】上記構成において、DFBレーザ部へしき

い電流値以上の電流を注入すると、活性層3はTE利得がTM利得よりわずかに大きいので、TE偏波モードで発振する状態になる(DFBレーザ部が単独でレーザ発振している状態である)。この状態において、DBR反射部の反射波長は、TM偏波モードに設定されているので(この様に設計しておく)、周回位相が一致しないために、DBR反射部は反射器として機能しない。

【0034】次に、電極293を介して位相調整領域へ電流注入して、ここの屈折率を変化させ(プラズマ効果で減少させる)、TM偏波モードであるDBR反射波長に対して合わせる。このことにより、DBR反射部をDBR反射器として機能させ、TM偏波モード光をDFBレーザ部へ反射させて、レーザ発振の偏波をTM偏波モードにスイッチングさせる。

【0035】第2実施例と同様、DFBレーザ部の活性 届のTM偏波の利得をTE偏波利得より大きくし、DB R反射部の反射波長をTE偏波モードに設定することに より、TM偏波からTE偏波へのスイッチングも可能で ある。

【0036】<u>第4実施例</u>

図3は、本発明の第4の実施例の光伝搬方向の概略構成 断面図であり、端面に反射防止膜201の形成されたD FBレーザ部と2つのDBR反射部で構成される。DF Bレーザ部の活性層3は第1実施例と同じ構成であり、 TE偏波モードとTM偏波モード間の利得差は小さい。 2つのDBR反射部は、電極分離溝309で分離された 電極310、311を夫々有すると共に、周期の異なる 回折格子312、313を夫々有する。図3において、 図1の符号と同符号で示すものは同じ機能の部分である ことを示す。

【0037】DFBレーザ部にしきい値以上の電流を注入すると、活性層3の両偏波モード間の利得差は小さいので、両方の偏波モードの利得がともに増大する。一方、DFBレーザ部に近い第1DBR反射部の反射波長はDFBレーザ部のTM偏波モードに一致し、DFBレーザ部のTE偏波モードに一致する様に設定されている。したがって、第1DBR反射部からTM偏波モードの光波が反射される為、TM偏波でレーザ発振する。

【0038】次に、第1DBR反射部に電流を注入してここの屈折率を減少させ、ブラッグ波長をTM偏波モードから短波長側にずらすと、第1DBR反射部がTM偏波モードの波長に対して透明となるので、第2DBR反射部からTE偏波モードの光波が反射されることになる。このことにより、DFBレーザ部へのTE偏波の反射量が増大し、レーザ発振がTM偏波からTE偏波にスイッチングする。注入キャリヤによる導波層の屈折率変化は、前述した様に1×10 18 / c m³に対し0.02

程度変化するので、第1DBR反射部をレーザ発振波長 に対して透明とするのに充分である。

[0039]

【発明の効果】以上説明した様に、TE偏波モードとT M偏波モードの利得差が小さい活性層を有するDFBレ ーザ部とDBR反射部が光の共振器方向に配置された分 布反射型半導体レーザにおいて、DBR反射部からのブ ラッグ反射光のDFBレーザ部への反射量を制御して、 レーザ発振をTE偏波/TM偏波モード間でスイッチン グさせることが可能となった。この様に、本発明では、 位相整合条件のみを制御するのではなく、DFBレーザ 部の各偏波モードとDBR反射部の反射波長の重なり具 合を主として制御することで、レーザ発振をTE偏波/ TM偏波モード間でスイッチングする原理を用いてい る。これにより、偏波変調レーザを作製する上で必要で あったTE利得とTM利得が殆ど一致していると言う条 件が、TE利得とTM利得の差が小さいことで充分とな ったので、従来、偏波変調レーザを作製する上で課題で あった活性層のTE利得とTM利得の一致、導波路の断 面形状、無反射コーティング端面の残留反射率、回折格 子の形状、素子温度、注入電流等の偏波依存性に対して 許容度が大きくなり、特性の揃った偏波変調レーザを作 製することが可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の第1実施例である偏波変調レーザの部分的に破断された概略構成斜視図である。

【図2】図2は、本発明の第3実施例である偏波変調レーザの概略構成断面図である。

【図3】図3は、本発明の第4実施例である偏波変調レーザの概略構成断面図である。

【図4】図4は、本発明の偏波変調レーザを送信部として使う場合の概略構成図である。

[図5] 図5は、本発明の偏波変調レーザを送信部に使用した波長多里通信ネットワークの概略構成図である。

【図6】図6は、偏波変調レーザの従来例を説明する図 である。

【符号の説明】

2 In P基板及びIn P下部クラッド層

3 活性層

4、13、241、242 光導波層

高抵抗 In P 埋込み屑

6 InP上部クラッド層

7 InGaAsオーミックコンタクト層

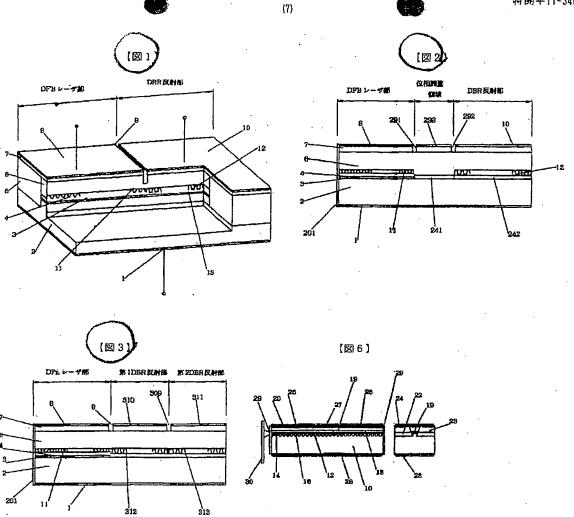
9, 291, 292, 309

電極分雕溝

间折格子

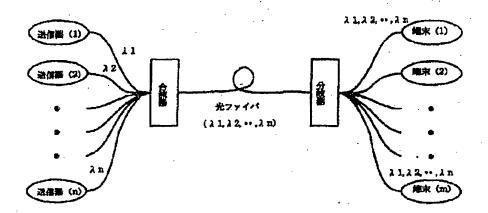






[図4] 電気信号 驱動回路 DFB DBR レーザ部 反射部 TE/TM TEorTM 分布反射型半導体レーザ 偏光選択手段

(図5)



٠.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: ____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.